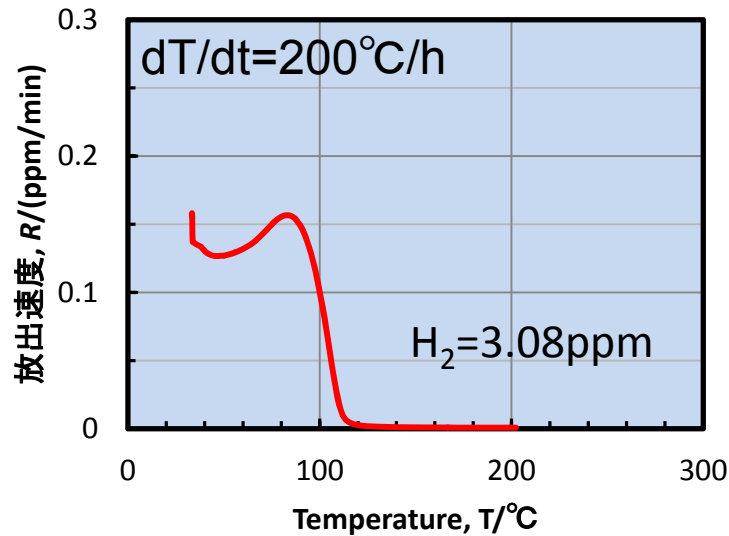
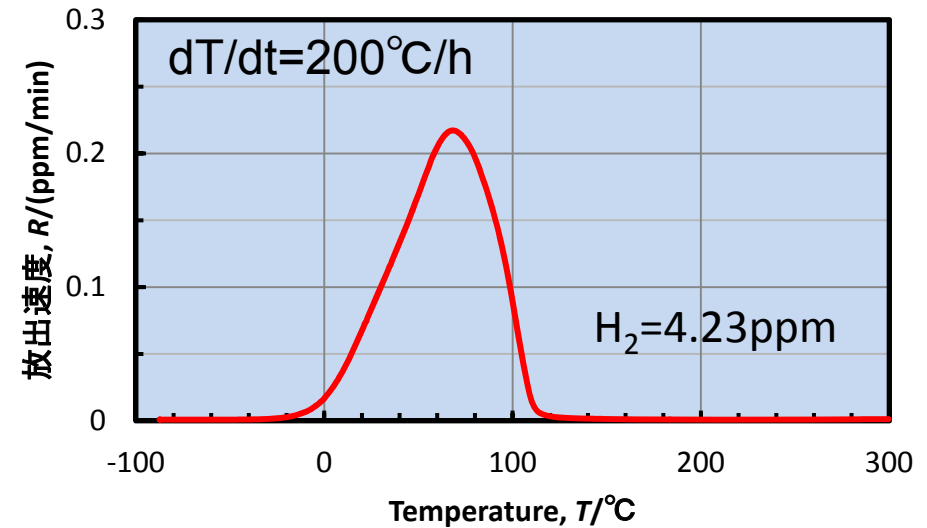


水素チャージした低炭素軟鋼板の水素の脱離特性

室温からのTDA測定

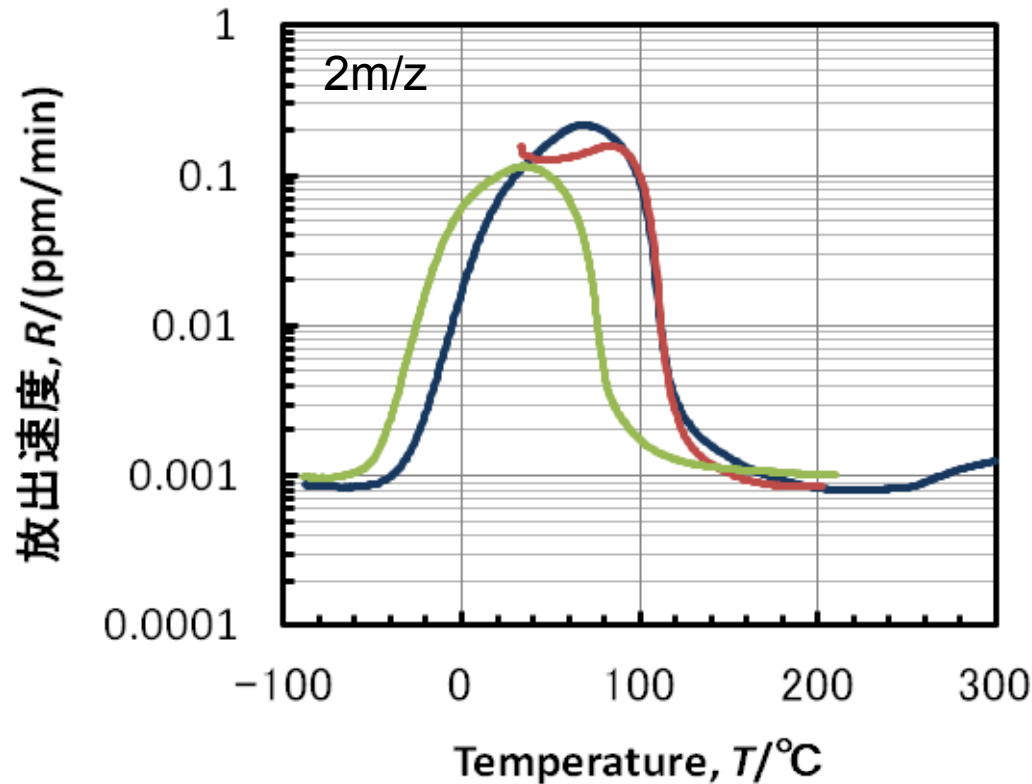


低温TDA(IH-TDS)による測定



室温で試験片から電界チャージした水素が抜けてしまうため、拡散性水素量を過少評価してしまいます。水素の拡散係数が大きい材料では、低温TDSによる評価が不可欠です。

水素チャージした低炭素軟鋼板の水素の脱離特性



試料ID#	昇温速度	水素量	積分範囲
①	200°C/hr	4.23 ppm	-75~175°C
②	200°C/hr	3.08 ppm	33.4~175°C
③	100°C/hr	4.36 ppm	-75~175°C

- ① 200°C/h
- ② 200°C/h
- ③ 100°C/h

サブゼロ温度からの昇温脱離測定例です。試験片からの水素の抜けなく、水の脱離の影響も受けずに拡散性水素の脱離プロファイルの測定が可能です。

試験片は10mm角で厚さ1mm。電界チャージにより水素をチャージしております。
IH-TDSでは試験片は最大20mmΦ、100gまで測定できます。受託測定も行っております。